

MICROSCOPE ÉLECTRONIQUE À BALAYAGE (SEM)

FABRICANT : FEI Company

MODÈLE : Quanta 3D FEG

Échantillons

- Muni d'un canon à effet de champs (FEG) permettant l'observation d'échantillons non-conducteurs
- Muni d'une source d'ion Ga⁺ : 2 à 30 kV, 1 pA à 65 nA avec une résolution de 7 nm

Analyses

- Canon à électron : 200 V à 30 kV, 200 nA maximum
- Résolution : 1,2 nm

Variantes

- Spectromètre de dispersion d'énergie (EDS) des rayons X pour l'analyse élémentaire par rayons X

Applications

- Observation d'échantillon à l'échelle nanométrique (SEM)
- Analyse élémentaire par rayons X (EDS)
- Gravure à l'échelle nanométrique (FIB)
- Analyse de coupes transverses de dépôts multicouches (FIB-SEM)